



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

UNIVERSIDAD DE VIGO
(CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO A INVESTIGACIÓN
(C.A.C.T.I.))

A, B, C, D, E, F, G y H) EDIFICIO C.A.C.T.I.-
CINBIO.
CAMPUS UNIVERSITARIO
36310 - VIGO
(PONTEVEDRA)

D y H) LABORATORIO C.A.C.T.I. -
PQ TECNOLOXICO DE GALICIA - TECNOPOLE.
EDIFICIO CTC
32901 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS
(OURENSE)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

SPECIFIED IN ANNEX TO THE CERTIFICATE

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

First issued on: 2010-05-20 Last issued: 2022-05-20 Validity date: 2025-05-20

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: ES-0528/2010

AENOR
Confia



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

Annex to IQNet Certificate Number ES-0528/2010
UNIVERSIDAD DE VIGO
(CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO A INVESTIGACIÓN
(C.A.C.T.I.))

Activities within the scope of IQNet Certificate UNIVERSIDAD DE VIGO
(CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO A INVESTIGACIÓN (C.A.C.T.I.)) Number ES-0528/2010
include the following:

- A) Proteomic, genomic and structural determination: Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), single crystal x-ray diffraction, mass spectrometry (MS), DNA sequencing and proteomics.
- B) Electron microscopy: Sample preparation, analysis of samples by scanning electron microscopy (SEM), by transmission electron microscopy (TEM), by optical and confocal-fluorescence microscopy. Energy dispersive spectroscopy (EDS). Dual-beam microscopy (FIB).
- C) Nanotechnology and surface analysis: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS), angle-resolved photoelectron spectroscopy, time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS), proximity microscopy (AFM, STM, and related techniques), nanomechanical analysis by nanoindentation, white light interferometric optical profilometry (WLOP), 3D optical profilometry, high resolution needle profilometry, tensiometry and contact angle.
- D) Food security and sustainable development: Sample preparation and characterization, atomic and molecular spectrometry determination, elemental analysis, ICP-MS spectrometry, chromatography, X-ray spectrometry. Stable isotope analysis. Radiochemical techniques. Nutrient analysis.
- E) Remote sensing: Space remote sensing, topographic laser scanning (LIDAR), hyperspectral remote sensing, infrared thermography, differential global positioning systems (DGPS), meteorological systems, remotely piloted aircraft systems (RPAS).
- F) Corrective maintenance servicing for electrical, electronic, mechanical and electro-mechanical equipment. Calibration of pipettes and balances.
- G) Designing and machining of metal and plastic parts.
- H) Loan service of analysis equipment to be used in self-service mode.

First issued on: **2010-05-20** Last issued: **2022-05-20** Validity date: **2025-05-20**

This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

AENOR
Confia

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi
Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AENOR

Confía



Certificado do Sistema de Xestión da Calidade



ER-0528/2010

AENOR certifica que a organización

UNIVERSIDAD DE VIGO CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO A INVESTIGACIÓN (C.A.C.T.I.)

dispón dun sistema de xestión da calidade segundo a norma ISO 9001:2015

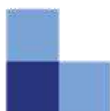
para as actividades: DETALLADAS NO ANEXO Ó CERTIFICADO

que se están a realizar en: A, B, C, D, E, F, G y H) EDIFICIO C.A.C.T.I.-CINBIO. CAMPUS
UNIVERSITARIO. 36310 - VIGO (PONTEVEDRA)
D y H) LABORATORIO C.A.C.T.I. - PQ TECNOLOXICO DE GALICIA -
TECNOPOLE. EDIFICIO CTC. 32901 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS
(OURENSE)

Data da primeira emisión: 2010-05-20

Data da última emisión: 2022-05-20

Data de expiración: 2025-05-20



Rafael GARCÍA MEIRO
Director Xeral

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com





Certificado do Sistema de Xestión da Calidade



ER-0528/2010

Anexo ó Certificado

Alcance: A) Determinación estrutural, proteómica e xenómica: Ensaio de resonancia magnética nuclear (RMN), difracción de raios X monocristal, espectrometría de masas (MS), secuenciación de ADN e proteómica.
B) Microscopía electrónica: Preparación de mostrás, análises de mostrás por microscopía electrónica de varrido (SEM), por microscopía electrónica de transmisión (TEM), por microscopía óptica e confocal-fluorescencia. Microanálises por dispersión de enerxía (EDS). Microscopía Dual-Beam (FIB).
C) Nanotecnoloxía e análise de superficies: Espectroscopía de fotoelectróns de raios X (XPS), Espectroscopía de fotoelectróns de ultravioleta (UPS), Espectroscopía de fotoelectróns de ángulo resolvido, Espectrometría de masas de ións secundarios por tempo de voo (TOF-SIMS), Microscopía de proximidade (AFM, STM, e técnicas afíns), Análises nanomécanicas por nanoindentación, perfilometría óptica interferométrica de luz branca (WLOP), Perfilometría óptica de variación de foco, Perfilometría de agulla de alta resolución, tensiometría e ángulo de

Data da primeira emisión: 2010-05-20
Data da última emisión: 2022-05-20
Data de expiración: 2025-05-20

Rafael GARCÍA MEIRO
Director Xeral





Certificado do Sistema de Xestión da Calidade



ER-0528/2010

Anexo ó Certificado

Alcance: contacto.
D) Seguridade alimentaria e desenvolvemento sostible: Preparación e caracterización de mostras, determinacións por espectrometría atómica e molecular, análise elemental, espectrometría de ICP-MS, cromatografía, espectrometría de raios X. Análise de isótopos estables. Técnicas radioquímicas. Análise de nutrientes.
E) Detección remota: Teledetección espacial, topografía mediante láser escáner (LIDAR), teledetección hiperespectral, termografía infravermella, sistemas de posicionamento global diferencial (DGPS), sistemas meteorolóxicos, vehículos aéreos non tripulados.
F) A prestación do servizo de mantemento correctivo de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos e electro-mecánicos. Calibración de pipetas e balanzas.
G) O deseño e mecanizado de pezas de metal e plástico.
H) O servizo de préstamo de equipos de análises e ensaio en réxime de

Data da primeira emisión: 2010-05-20
Data da última emisión: 2022-05-20
Data de expiración: 2025-05-20



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Rafael GARCÍA MEIRO
Director Xeral



AENOR
Confía



Certificado do Sistema de Xestión da Calidade

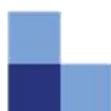


ER-0528/2010

Anexo ó Certificado

Alcance: autoservizo.

Data da primeira emisión: 2010-05-20
Data da última emisión: 2022-05-20
Data de expiración: 2025-05-20



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Rafael GARCÍA MEIRO
Director Xeral



AENOR
Confía



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0528/2010

AENOR certifica que la organización

UNIVERSIDAD DE VIGO CENTRO DE APOYO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO A INVESTIGACIÓN (C.A.C.T.I.)

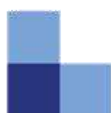
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en: A, B, C, D, E, F, G y H) EDIFICIO C.A.C.T.I.-CINBIO. CAMPUS
UNIVERSITARIO. 36310 - VIGO (PONTEVEDRA)
D y H) LABORATORIO C.A.C.T.I. - PQ TECNOLÓGICO DE GALICIA -
TECNOPOLE. EDIFICIO CTC. 32901 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS
(OURENSE)

Fecha de primera emisión: 2010-05-20
Fecha de última emisión: 2022-05-20
Fecha de expiración: 2025-05-20

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com





Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



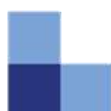
ER-0528/2010

Anexo al Certificado

Alcance: A) Determinación estructural, proteómica y genómica: Ensayos de resonancia magnética nuclear (RMN), difracción de rayos X monocristal, espectrometría de masas (MS), secuenciación de ADN y proteómica.
B) Microscopía electrónica: Preparación de muestras, análisis de muestras por microscopía electrónica de barrido (SEM), por microscopía electrónica de transmisión (TEM), por microscopía óptica y confocal-fluorescencia. Microanálisis por dispersión de energía (EDS). Microscopía Dual-Beam (FIB).
C) Nanotecnología y análisis de superficies: Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS), Espectroscopía de fotoelectrones de ultravioleta (UPS), Espectroscopía de fotoelectrones de ángulo resuelto, Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (TOF-SIMS), Microscopía de proximidad (AFM, STM, y técnicas afines), Análisis nanomecánicos por nanoindentación, perfilometría óptica interferométrica de luz blanca (WLOP), Perfilometría óptica de variación de foco, Perfilometría de aguja de alta resolución, tensiometría y ángulo de

Fecha de primera emisión: 2010-05-20
Fecha de última emisión: 2022-05-20
Fecha de expiración: 2025-05-20

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

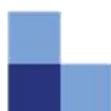


ER-0528/2010

Anexo al Certificado

Alcance: contacto.
D) Seguridad alimentaria y desarrollo sostenible: Preparación y caracterización de muestras, determinaciones por espectrometría atómica y molecular, análisis elemental, espectrometría de ICP-MS, cromatografía, espectrometría de rayos X. Análisis de isótopos estables. Técnicas radioquímicas. Análisis de nutrientes.
E) Detección remota: Teledetección espacial, topografía mediante láser escáner (LIDAR), teledetección hiperespectral, termografía infrarroja, sistemas de posicionamiento global diferencial (DGPS), sistemas meteorológicos, vehículos aéreos no tripulados.
F) La prestación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos y electro-mecánicos. Calibración de pipetas y balanzas.
G) El diseño y mecanizado de piezas de metal y plástico.
H) El servicio de préstamo de equipos de análisis y ensayo en régimen de autoservicio.

Fecha de primera emisión: 2010-05-20
Fecha de última emisión: 2022-05-20
Fecha de expiración: 2025-05-20



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0528/2010

Anexo al Certificado

Alcance:

Fecha de primera emisión: 2010-05-20
Fecha de última emisión: 2022-05-20
Fecha de expiración: 2025-05-20



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General